

# OBSAH

<b>Predhovor</b>	5	
<b>1</b>	<b>Úvod do problematiky</b>	7
1.1	Liatiny a ich štruktúra.	7
1.1.1	Biele liatiny	8
1.1.2	Sivá liatina	8
1.1.2.1	Štruktúra tekutého kovu	10
1.1.2.2	Eutektická reakcia	11
1.1.2.3	Tuhnutie fosfidového eutektika a fázové premeny v tuhom stave	13
1.1.2.4	Vplyv štruktúrnych zložiek na vlastnosti liatiny	14
1.1.3	Modifikované liatiny	15
1.1.3.1	Morfologické varianty grafitu	15
1.1.3.2	Tvárná liatina	16
1.1.3.3	Liatina s červíkovitým grafitom	18
1.1.4	Tepelne spracované liatiny	21
1.1.4.1	Temperované liatiny	21
1.1.4.2	Tepelne spracované modifikované liatiny	23
1.2	Metódy štruktúrnej analýzy	24
1.2.1	Zobrazovacie metódy štruktúrnej analýzy	24
1.2.2	Analytické metódy	27
	<b>Literatúra</b>	28
<b>2</b>	<b>Svetelná metalografická mikroskopia</b>	29
2.1	Základy svetelnej metalografie	29
2.1.1	Príprava metalografických vzoriek	29
2.1.1.1	Odber vzoriek	29
2.1.1.2	Preparácia vzoriek, brúsenie a leštenie	30
2.1.1.3	Zviditeľnenie štruktúry	31
2.1.2	Svetelný mikroskop	33
2.1.2.1	Optika mikroskopu	34
2.1.2.2	Charakteristiky mikroskopu	36
2.1.2.3	Spôsoby osvetlenia a zobrazovania	37
2.1.2.4	Meranie mikrotvrdosti	42

2.1.3	Princípy metalografickej analýzy . . . . .	43
2.2	Metalografia liatin . . . . .	45
2.2.1	Základné postupy a metódy . . . . .	45
2.2.1.1	Hodnotenie grafitu . . . . .	45
2.2.1.2	Štruktúra matice v liatom stave . . . . .	54
2.2.1.3	Tepelne spracované liatiny . . . . .	60
2.2.1.4	Primárna štruktúra a eutektické bunky . . . . .	63
2.2.1.5	Štruktúra zvarov . . . . .	66
2.2.2	Príklady špecifického použitia svetelnej mikroskopie . . . . .	67
2.2.2.1	Štúdium zmien štruktúry počas tuhnutia . . . . .	68
2.2.2.2	Tvorba triesky pri obrábaní . . . . .	69
2.2.2.3	Štúdium napäťových polí . . . . .	70
2.2.3	Farebná metalografia . . . . .	73
2.2.3.1	Teoretické základy . . . . .	73
2.2.3.2	Farebné leptanie . . . . .	74
2.2.3.3	Interferenčné vrstvy . . . . .	76
2.3	Kvantitatívna metalografia . . . . .	78
2.3.1	Teoretické základy . . . . .	78
2.3.1.1	Geometrická pravdepodobnosť kvantitatívnej metalografie . . . . .	79
2.3.1.2	Prehľad základných vybraných úloh kvantitatívnej metalografie . . . . .	84
2.3.2	Obrazová analýza . . . . .	91
2.3.2.1	Základné princípy obrazovej analýzy riadenej počítačom . . . . .	91
2.3.2.2	Funkcia obrazového analyzátoru . . . . .	93
2.3.2.3	Rozšírené uplatnenie obrazovej analýzy . . . . .	99
2.3.3	Aplikácie metód kvantitatívnej metalografie pri liatinách . . . . .	100
	<b>Literatúra . . . . .</b>	105
<b>3</b>	<b>Elektrónová mikroskopia . . . . .</b>	107
3.1	Transmisién elektrónový mikroskop . . . . .	107
3.1.1	Princíp a funkcia . . . . .	107
3.1.1.1	Základná charakteristika transmisién elektrónového mikroskopu . . . . .	107
3.1.1.2	Základná zostava a opis funkcie . . . . .	108
3.1.2	Príprava preparátov . . . . .	113
3.1.2.1	Všeobecná charakteristika požiadaviek na preparáty pre elektrónovú mikroskopiu . . . . .	113
3.1.2.2	Preparáty na priame pozorovanie štruktúry kovov . . . . .	114
3.1.2.3	Preparáty na nepriame pozorovanie štruktúr kovov — repliky . . . . .	118
3.1.3	Tvorba a interpretácia obrazu . . . . .	121
3.1.3.1	Nekoherentný pružný rozptyl a kontrast . . . . .	123
3.1.3.2	Koherentný pružný rozptyl a difrakcia . . . . .	126
3.2	Využitie transmisién elektrónovej mikroskopie . . . . .	132
3.2.1	Základné princípy a možnosti . . . . .	132
3.2.1.1	Štúdium štruktúry kovov na tenkých fóliách . . . . .	132
3.2.1.2	Štúdium štruktúry kovov pomocou replík . . . . .	133
3.2.2	Osobitosti aplikácie pri štúdiu liatin . . . . .	135
3.3	Rastrovací elektrónový mikroskop . . . . .	144
3.3.1	Princíp a funkcia . . . . .	144
3.3.1.1	Praktické využitie . . . . .	144
3.3.1.2	Základná zostava a opis funkcie . . . . .	145

3.3.1.3 Chyby optického systému . . . . .	147
3.3.1.4 Hĺbka ostrosti . . . . .	150
3.3.2 Vznik a charakteristika jednotlivých druhov signálov . . . . .	151
3.3.2.1 Interakcia primárnych elektrónov s materiálom. . . . .	151
3.3.2.2 Emisia elektrónov zo vzorky . . . . .	153
3.3.3 Tvorba obrazu a interpretácia signálov . . . . .	160
3.3.3.1 Tvorba obrazu v REM . . . . .	160
3.3.3.2 Tvorba kontrastu . . . . .	162
3.3.3.3 Obmedzenie rozlišovacej schopnosti a kontrastu v REM . . . . .	164
3.3.3.4 Elektronické spracovanie signálov. . . . .	168
3.4 Využitie rastrovacej elektrónovej mikroskopie . . . . .	171
3.4.1 Mikroštruktúrna analýza . . . . .	171
3.4.1.1 Hodnotenie štruktúrnych častí v rovinnom reze . . . . .	171
3.4.1.2 Priestorové defekty štruktúry. . . . .	174
3.4.1.3 Priestorová morfológia fáz. . . . .	176
3.4.2 Mikrofraktografická analýza . . . . .	185
3.4.2.1 Teoretické základy . . . . .	185
3.4.2.2 Porušovanie grafitu . . . . .	191
3.4.2.3 Porušovanie matrice . . . . .	194
3.4.2.4 Únavový lom. . . . .	200
<b>Literatúra . . . . .</b>	<b>203</b>
<b>4 Elektrónová mikroanalýza . . . . .</b>	<b>205</b>
4.1 Fyzikálne základy. . . . .	205
4.1.1 Budenie röntgenového žiarenia . . . . .	205
4.1.2 Absorpcia a fluorescencia . . . . .	208
4.1.3 Hĺbka vzniku a priestorová rozlišovacia schopnosť röntgenového žiarenia . . . . .	209
4.2 Elektrónový mikroanalyzátor ako analytický prístroj . . . . .	212
4.2.1 Opis prístroja . . . . .	212
4.2.2 Detekcia röntgenového žiarenia. . . . .	213
4.2.2.1 Kryštálový spektrometer. . . . .	213
4.2.2.2 Polovodičový spektrometer. . . . .	216
4.2.2.3 Porovnanie kryštálového a polovodičového spektrometra . . . . .	216
4.3 Experimentálna prax elektrónovej mikroanalýzy a korekčné systémy . . . . .	217
4.3.1 Korekčná metóda ZAF . . . . .	217
4.3.2 Experimentálna prax elektrónovej mikroanalýzy . . . . .	220
4.3.2.1 Metódy elektrónovej mikroanalýzy . . . . .	220
4.3.2.2 Príprava vzoriek . . . . .	222
4.3.2.3 Výber štandardov. . . . .	224
4.3.2.4 Základné parametre analýzy . . . . .	225
4.3.2.5 Medza citlivosti (detekcie) . . . . .	226
4.4 Využitie elektrónovej analýzy pri štúdiu liatin . . . . .	226
4.4.1 Lineárna a plošná kvalitatívna mikroanalýza kryštálovým spektrometrom . . . . .	226
4.4.2 Kvantitatívna bodová elektrónová mikroanalýza kryštálovým spektrometrom . . . . .	229
4.4.3 Bodová kvalitatívna analýzy energovo-disperzným spektrometrom . . . . .	231
<b>Literatúra . . . . .</b>	<b>231</b>
<b>5 Metódy analýzy povrchu . . . . .</b>	<b>233</b>

5.1	Základné princípy vybraných metód analýzy povrchu . . . . .	233
5.1.1	Prehľad metód analýzy povrchu a ich charakteristika . . . . .	233
5.1.2	Augerova elektrónová spektroskopia (AES) . . . . .	235
5.1.3	Fotoelektrónová spektroskopia (XPS — ESCA) . . . . .	238
5.1.4	Hmotnostná spektroskopia sekundárnych iónov . . . . .	240
5.1.5	Zhrnutie . . . . .	241
5.2	Analytické využitie AES pri štúdiu liatin. . . . .	242
	<b>Literatúra . . . . .</b>	<b>244</b>